

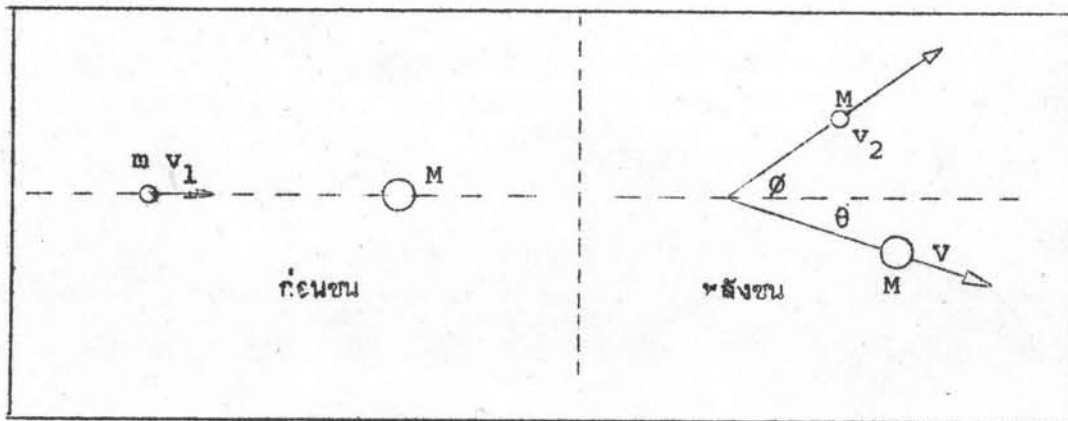


ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง

3.1 การชนของอิเล็กตรอน (Electron collision)

การใช้อิเล็กตรอนเข้าชนกับอะตอมเป็นการให้พลังงานแก่อะตอมวิธีหนึ่ง ถ้าอิเล็กตรอนที่เข้าชนมีพลังงานสูงกว่าศักย์การเกิดไอออน ผลจะทำให้อะตอมกลายเป็นไอออนได้ในระหว่างการชนอิเล็กตรอนจะให้พลังงานจลน์แก่อิเล็กตรอนอนุภาคหนึ่งที่อยู่ในอะตอม หลังจากนั้นอิเล็กตรอนที่เข้าชนจะเคลื่อนที่ช้าลงและโดยทั่ว ๆ ไปทิศทางจะเปลี่ยนด้วย ในการชนครั้งหนึ่ง ๆ นั้นถ้าพลังงานภายในของอะตอมเพิ่มขึ้น การชนลักษณะนี้จะเรียกว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (inelastic collision) แต่ถ้าในระหว่างการชน พลังงานภายในอะตอมไม่เปลี่ยนแปลง ผลคือโมเมนตัมและพลังงานจลน์ของการส่งผ่านอนุภาค การชนกรณีนี้เรียกว่า การชนแบบยืดหยุ่น (elastic collision)

กรณีง่าย ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการชนแบบยืดหยุ่นอิเล็กตรอนมีการสูญเสียพลังงาน สมมติว่าอิเล็กตรอนก่อนชนมีมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v_1 และอะตอมมีมวล M หยุดนิ่งอยู่กับที่ หลังชนอิเล็กตรอนและอะตอมมีความเร็ว v_2 และ V ทำมุม ϕ และ θ กับแนวที่เข้าชนตามลำดับดังรูป 3.1



รูปที่ 3.1 แสดงการชนของอิเล็กตรอนกับอะตอม

โดยอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัม (conservation of momentum) และการอนุรักษ์พลังงาน (conservation of energy) สามารถเขียนสมการเป็น

$$mv_1 = mv_2 \cos \phi + MV \cos \theta \quad (3.1)$$

$$mv_2 \sin \phi = MV \sin \theta \quad (3.2)$$

และ
$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}MV^2 \quad (3.3)$$

จาก (3.1), (3.2), และ (3.3) แสดงได้เป็น

$$\frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 \cdot \frac{4Mm \cos^2 \theta}{(M+m)^2} \quad (3.4)$$

ถ้า $M \gg m$ สมการ (3.4) สามารถเขียนได้เป็น

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}MV^2 &= \frac{1}{2}mv_1^2 \cdot \frac{4m}{M} \cos^2 \theta \\ E_a &= E_e \frac{4m}{M} \cos^2 \theta \end{aligned} \quad (3.5)$$

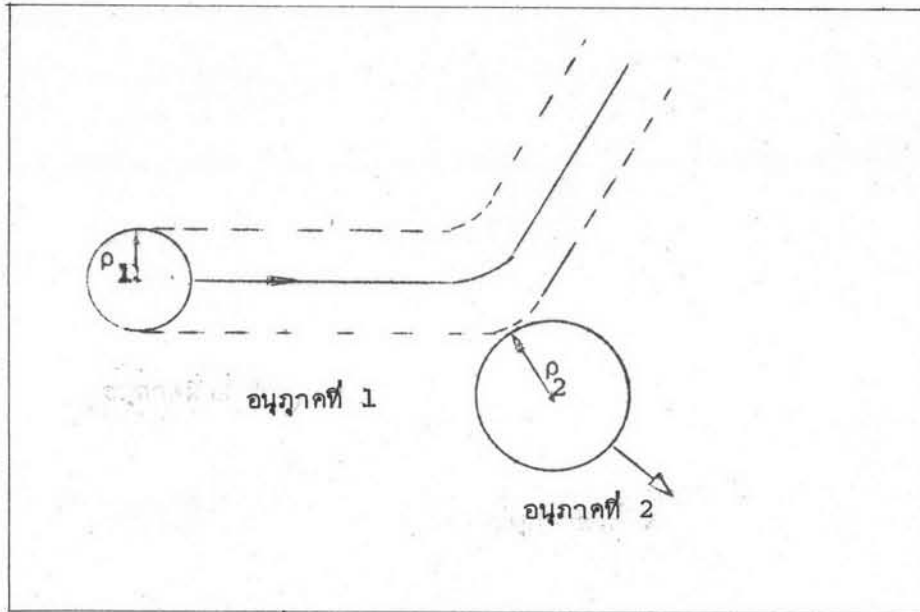
เมื่อ E_e เป็นพลังงานจลน์เริ่มต้นของอิเล็กตรอน และ E_a เป็นพลังงานจลน์ที่อะตอมได้รับในระหว่างการชน

ในการชนของอิเล็กตรอนกับอะตอมผลที่เป็นไปได้มี 3 ประการคือ อิเล็กตรอนอาจจะทำให้อะตอมโลด (excite) อาจจะทำให้อะตอมเป็นไอออน หรืออาจจะทำให้เกิดการชนแบบยืดหยุ่น โอกาสที่จะเป็นชนิดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของอิเล็กตรอน ถ้าอิเล็กตรอนที่เข้าชนมีพลังงานน้อย การเกิดไอออนของอะตอมอาจจะไม่มี จะเป็นไปได้ในอีกสองกรณีเท่านั้น แต่ ถ้าให้พลังงานแก่อิเล็กตรอนที่เข้าชนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งทำให้อิเล็กตรอนในอะตอมได้รับพลังงานเท่ากับความแตกต่างของพลังงานระหว่างสถานะเริ่มต้น (initial state) กับสถานะสุดท้ายแล้ว อะตอมจึงจะเป็นไอออน ดังนั้นอิเล็กตรอนที่เข้าชนจึงต้องมีพลังงานสูงกว่าศักย์การเกิดไอออนของอะตอม

3.2 ระยะทางของการเคลื่อนที่เฉลี่ย (Mean free path)

ในการชนกันระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมหรือโมเลกุลนั้น สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ระยะทางของการเคลื่อนที่เฉลี่ยระหว่างการชน

ถ้าพิจารณาถึงว่าอนุภาคมีรูปทรงคล้ายของแข็งยืดหยุ่นทรงกลม (solid elastic spheres) และการชนเป็นไปดังรูป 3.2



รูปที่ 3.2 แสดงการชนของอนุภาค

ให้อนุภาคที่ 1 และ 2 มีรัศมีเป็น ρ_1 และ ρ_2 ตามลำดับ ดังนั้นการชนของอนุภาค จะอยู่ภายในช่วง $\rho_1 + \rho_2$ ซึ่งนับจากจุดศูนย์กลางของมวลทั้งสอง สมมติว่าอิเล็กตรอนที่ เข้าชนกับโมเลกุลของก๊าซเป็นจุด ดังนั้นอัตราการกระเจิง (rate of scattering) จากลำ อิเล็กตรอนมีความสัมพันธ์ดังสมการ⁹

$$\frac{-dN}{dx} = kN \quad (3.6)$$

อินทิเกรตสมการ (3.6) ในช่วง N_0 ถึง N กับ 0 ถึง x

$$\begin{aligned} \int_{N_0}^N \frac{dN}{N} &= -k \int_0^x dx \\ \ln \frac{N}{N_0} &= -kx \\ N &= N_0 e^{-kx} \end{aligned} \quad (3.7)$$

ถ้า λ เป็นระยะทางของการเคลื่อนที่เฉลี่ย ซึ่งจะกำหนดโดยสมการ

$$\lambda = \int_0^{N_0} \frac{x dN}{N_0} \quad (3.8)$$

จาก (3.7) สามารถดิฟเฟอเรนเชียลเป็น

$$dN = -kN_0 e^{-kx} dx \quad (3.9)$$

สมการ (3.9) แทนใน (3.8) จะได้

$$\lambda = \int_0^{N_0} -kx e^{-kx} dx \quad (3.10)$$

สมการ (3.10) สามารถอินทิเกรตได้โดยให้ $y = kx$ ดังนั้น

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1}{k} \int_0^{\infty} y e^{-y} dy \\ &= \frac{1}{k} \Gamma(2) \\ \lambda &= \frac{1}{k} \end{aligned} \quad (3.11)$$

k เป็นค่าคงที่ (proportionality constant) เป็นพารามิเตอร์ (parameter)

ของกาซที่ใช้เป็นเป้าซึ่งดูได้จากสมการ (3.6) คือ

$$k = - \frac{dN}{N dx} \quad (3.12)$$

ค่าคงที่ K จะอยู่ในรูปที่เป็นสัดส่วนกับพื้นที่ตัดขวาง (cross-sectional area) โดยที่พื้นที่หน้าตัดขวางของการเข้าชนเป็น $\pi(\rho_1 + \rho_2)^2$ ถ้า N เป็นจำนวนโมเลกุลในปริมาตร V โดยสอดคล้องกับสมการ (3.12)

$$k = \pi(\rho_1 + \rho_2)^2 \frac{N}{V} \tag{3.13}$$

สมการ (3.13) แทนใน (3.11)

$$\lambda = \frac{V}{\pi(\rho_1 + \rho_2)^2 N} \tag{3.14}$$

ค่า λ ในสมการ (3.14) มากเกินไปเพราะว่าการชนเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ค่าในสมการ (3.14) ถูกต้องจะอาศัยการแจกแจงความเร็วของแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมานน์แก้ไขได้เป็น

$$\lambda = \frac{V}{\pi(\rho_1 + \rho_2)^2 N(2)^{1/2}} \tag{3.15}$$

สำหรับก๊าซในอุดมคติ (ideal gas) จะแทน $V = \frac{NKT}{P}$ ใน (3.15)

$$\lambda = \frac{KT}{\pi(\rho_1 + \rho_2)^2 P(2)^{1/2}} \tag{3.16}$$

- เมื่อ T เป็นอุณหภูมิสัมบูรณ์
- P เป็นความดันของก๊าซ
- K เป็นค่าคงที่ของโบลต์ซมานน์

3.3 การเกิดไอออนบวก

รูปแบบดั้งเดิมของการเกิดไอออนจะต้องประกอบด้วยอิเล็กตรอนเข้าชนโมเลกุลหรือเป้าที่เป็นกลาง การชนของอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงกับอิเล็กตรอนที่หมุนอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสอาจจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากวงโคจรได้ ดังนั้นจะเกิดมีโมเลกุล หรืออะตอมที่มีประจุเป็นบวก ที่เรียกว่าไอออนบวก แต่ถ้าโมเลกุลที่เป็นกลางถูกกลืนอิเล็กตรอนที่ชนดังนั้นไอออนลบก็จะเกิดขึ้น สำหรับการเกิดไอออนบวกปกติจะแทนโดยความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้



ที่ความดันต่ำ ๆ อัตราการเกิดไอออนบวกต่อหนึ่งหน่วยความยาวกำหนดโดยความสัมพันธ์

$$\frac{d}{dt} (AB^+) = k(AB) (N_e)$$

$$N_e = \text{เป็นจำนวนอิเล็กตรอน}$$

$$k = \text{เป็นค่าคงที่}$$

$$AB = \text{เป็นโมเลกุล หรือเป้าที่เป็นกลาง}$$

ปกติถ้าความดันของ (AB) และกระแสอิเล็กตรอนคงที่แล้ว ความเข้มของไอออนจะคงที่โดยสอดคล้องกับสมการ (3.18) อัตราการเกิดไอออนเป็นฟังก์ชันเชิงเส้น (linear function) ทั้งความดันและความเข้มของอิเล็กตรอน⁹

3.4 จำนวนไอออนที่เกิดขึ้นจากการชนของอิเล็กตรอน

ถ้าลำอิเล็กตรอนที่มีความเข้ม I_0 ผ่านเข้าไปในก๊าซที่มีความหนาแน่น N_0 เป็นระยะทาง x เมื่ออิเล็กตรอนชนกับโมเลกุลของก๊าซแล้วผลทำให้ความเข้มของอิเล็กตรอนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาการเกิดไอออน (ionization reactions) การลดความเข้มของอิเล็กตรอนเป็นไปโดยสมการ

$$-dI = \sigma_+ N_0 I_0 dx \quad (3.19)$$

σ_+ คือ หน้าตัดขวาง (cross section) สำหรับการเกิดไอออนบวก

ถ้า σ_+ ไม่เป็นฟังก์ชันของระยะทาง สมการ (3.19) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{dI}{I} = -\sigma_+ N_0 dx \quad (3.20)$$

อินทิเกรตสมการ (3.20) จะได้

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = - \int_0^x \sigma_+ N_0 dx$$

$$I = I_0 e^{-\sigma_+ N_0 x} \quad (3.21)$$

ในการเกิดไอออนอีเลกตรอนจะสูญหายไป เพื่อทำให้เกิดไอออนลบซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปคณิตศาสตร์ได้เป็น

$$I_0 - I = N^- \quad (3.22)$$

เมื่อ N^- เป็นจำนวนไอออนลบที่เกิดขึ้น

การทำให้เกิดไอออนลบ ย่อมหมายถึงการทำให้เกิดไอออนบวกด้วยโดยอาศัยความจริงนี้ จากสมการ (3.21) และ (3.22) จะได้

$$N^+ = I_0 - I_0 e^{-\sigma_+ N_0 x}$$

$$= I_0 (1 - e^{-\sigma_+ N_0 x}) \quad (3.23)$$

เมื่อ N^+ เป็นจำนวนไอออนบวกที่เกิดขึ้น

กระจาย $e^{-\sigma_+ N_0 x}$ โดยให้ $Z = \sigma_+ N_0 x$

$$\text{ดังนั้น } e^{-Z} = 1 - Z + \frac{Z^2}{2!} - \frac{Z^3}{3!} + \dots \quad (3.24)$$

ที่มีความดันต่ำ ๆ และระยะทางน้อย ๆ จากการประมาณสมการ (3.24) จะได้

$$e^{-\sigma_+ N_0 x} = 1 - \sigma_+ N_0 x \quad (3.25)$$

สมการ (3.25) แทนใน (3.23) ได้

$$\begin{aligned} N^+ &= I_0 (1 - (1 - \sigma_+ N_0 x)) \\ N^+ &= I_0 \sigma_+ N_0 x \\ \text{หรือ } N^+ &= \sigma_+ N_0 N_e x \quad (3.26) \end{aligned}$$

เมื่อแทน I_0 ด้วยจำนวนอิเล็กตรอน N_e ที่ผ่านเข้าในบริเวณการเกิดไอออน จะเห็นว่าสมการ (3.26) สามารถหาจำนวนไอออนบวกที่เกิดในแหล่งกำเนิดไอออนโดยใช้อิเล็กตรอนระดมยิงได้⁸

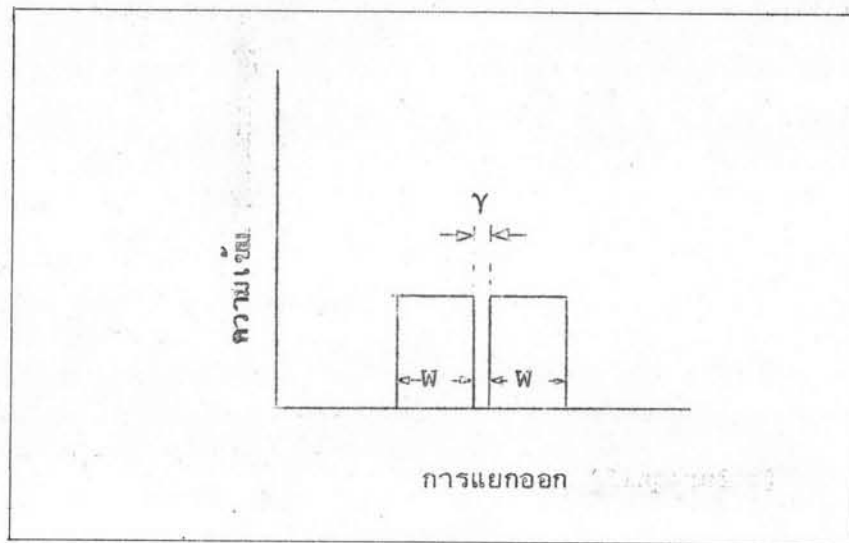
3.5 ความสามารถในการแยกมวลหรือกำลังการแยก (Resolution or Resolving power)

ในการแยกสเปกตรัมมวลนั้นสิ่งหนึ่งที่จะบอกถึงการแยกลำไอออนที่มีมวล M และ $M+\Delta M$ คือความสามารถในการแยกมวลหรือกำลังการแยกซึ่งมีนิยามดังนี้⁹

ถ้า R_S เป็นความสามารถในการแยกมวล ดังนั้น

$$R_S = \frac{M}{\Delta M} \quad (3.27)$$

ในการแยกลำไอออนถ้า D เป็นระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางลำไอออนและ W เป็นความกว้างของลำไอออนแต่ละลำ ลำไอออนที่อยู่ติดกันจะแยกออกจากกันได้ก็ต่อเมื่อ D ต้องมีค่ามากกว่า W เล็กน้อย ดังในรูป 3.3



รูปที่ 3.3 แสดงการแยกคลื่นไอออนที่มีความกว้าง W

ถ้าให้ D มากกว่า W อยู่ γ

$$D = W + \gamma \quad (3.28)$$

ค่า D เรียกว่าการแยกออก (dispersion)

ในการแยกคลื่นไอออนที่มีมวล M และ $M + \Delta M$ นั้นสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันของการแยกออกได้เป็น

$$\Delta M = \frac{W + \gamma}{D} \quad (3.29)$$

ที่เขียนดังสมการ (3.29) ได้เพราะ ΔM จะให้มีค่าเป็น 1 a.m.u.

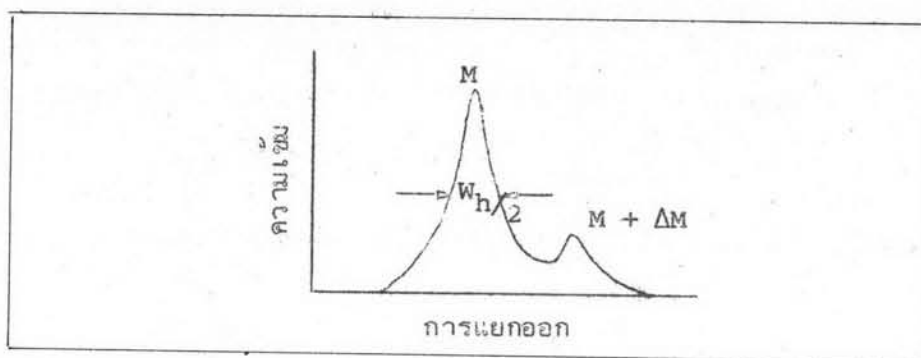
สมการ (3.29) แทนในสมการ (3.27) ได้

$$R_s = \frac{MD}{W + \gamma} \quad (3.30)$$

เนื่องจากในการหาความสามารถในการแยกไม่มีสูตรที่แน่นอน ดังนั้นในบางครั้ง ความสามารถในการแยกมวลอาจกำหนดจากความกว้างของลำไอออนที่ครึ่งหนึ่งของความเข้มสูงที่สุด นั่นคือ

$$R_s = \frac{MD}{W_{h/2}} \quad (3.31)$$

เมื่อ $W_{h/2}$ เป็นความกว้างของลำไอออนที่ครึ่งหนึ่งของความเข้มสูงที่สุดดังรูป 3.4



รูปที่ 3.4 แสดงความกว้างที่ครึ่งหนึ่งของความเข้มสูงที่สุด

สำหรับเครื่องแยกสเปกตรัมมวล ลำไอออนไม่จำเป็นต้องมีความเข้มเท่ากันและบางครั้งขอบของลำไอออนจะซ้อนกัน (overlap) เนื่องจากมวลของไอออนขึ้นอยู่กับค่า R , H และ V ดังนั้นถ้าใช้สมการ (3.30) จะหาค่าความสามารถในการแยกมวลจากตัวแปรค่า R , H และ V ได้ จากสมการ (1.3) ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรค่าคือ

$$\frac{M}{q} = \frac{R^2 H^2}{2VC^2}$$

โดยการดิฟเฟอเรนเชียลเอทสมการข้างบนนี้จะได้

$$\frac{\Delta M}{M} = \frac{2\Delta R}{R} + \frac{2\Delta H}{H} - \frac{\Delta V}{V} \quad (3.32)$$

สำหรับสนามแม่เหล็กมีค่าสม่ำเสมอ (homogeneous magnetic field) และ ไอออนไม่เกิดการแผ่กระจายพลังงาน (energy spread) สมการ (3.32) เทอมสุดท้ายสองเทอมเป็นศูนย์ ดังนั้นได้

$$\frac{\Delta M}{M} = \frac{2\Delta R}{R}$$

$$\text{หรือ } 2\Delta R = \frac{R\Delta M}{M} \quad (3.33)$$

สมการ (3.33) เป็นปริมาณที่กำหนดค่าการแยกออก

$$D = 2\Delta R$$

$$\text{หรือ } D = \frac{R\Delta M}{M} \quad (3.34)$$

โดยทั่วไป $\Delta M = 1$ ดังนั้นสมการ (3.34) จะเขียนใหม่ได้เป็น

$$D = \frac{R}{M} \quad (3.35)$$

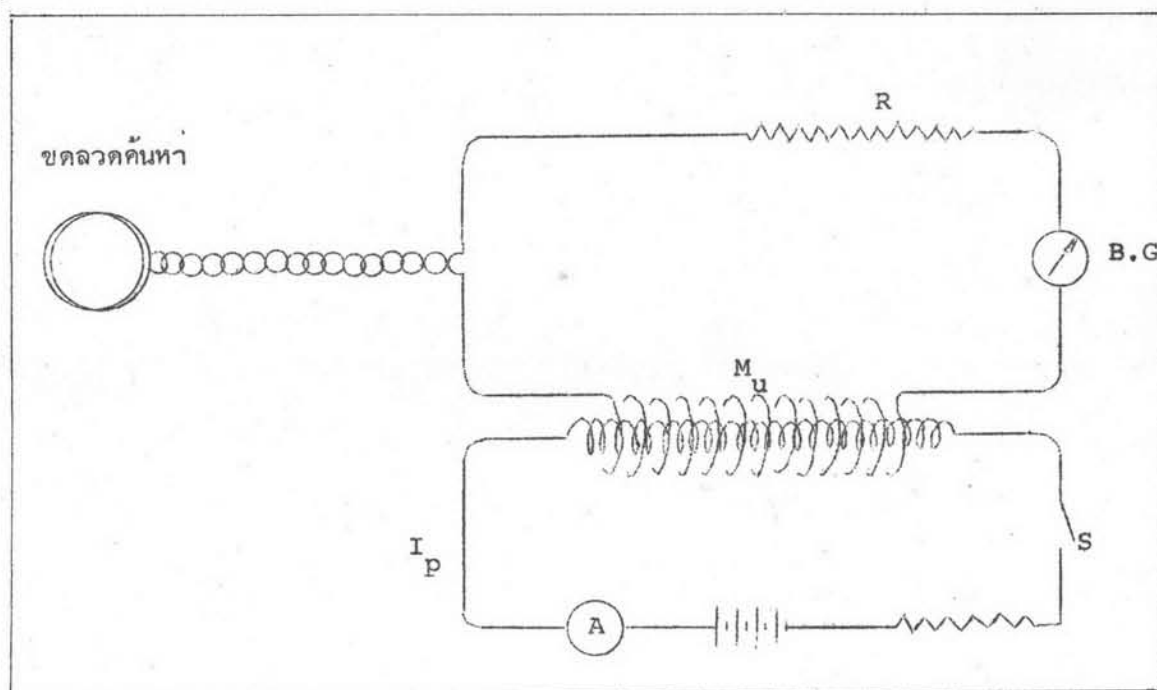
แทนค่า D จากสมการ (3.34) ลงในสมการ (3.30) ได้

$$R_s = \frac{R}{W + \gamma} \quad (3.36)$$

จากสมการ (3.36) แสดงถึงค่าความสามารถในการแยกมวล ซึ่งไม่ขึ้นกับมวล แต่ขึ้นอยู่กับรัศมีของเครื่องมือ และความกว้างของลำไอออนสำหรับความกว้างของลำไอออนนั้นจะมีความสัมพันธ์กับความกว้างของช่องแคบไอออนเข้า (entrance slit) S_2 และช่องแคบไอออนออก (exit slit) S_4 คือ $W \approx S_2 + S_4$ และ $\gamma = 0.1 W$ ^{6,9,10,11}

3.6 การวัดสนามแม่เหล็ก

ในการวัดอาศัยขดลวดค้นหา (search coil) ตัดกับสนามแม่เหล็ก แล้วคำนวณค่าสนามแม่เหล็กโดยอาศัยวงจรในรูป 3.5



รูปที่ 3.5 แสดงวงจรการวัดสนามแม่เหล็กโดยขดลวดค้นหา

จากรูปที่ 3.5 ขดลวดค้นหา มีพื้นที่หน้าตัดเป็น A มีจำนวนรอบเป็น N ต่ออนุกรมกับ ขัลลิสติก กัลวานอมิเตอร์ (ballistic galvanometer) ความต้านทาน R และความเหนี่ยวนำร่วมมาตรฐาน (standard mutual inductance) M_u ถ้าขดลวดมีระนาบตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นฟลักซ์ B และดึงออกจากสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา Δt ดังนั้นจะมีกระแสไหลผ่านกัลวานอมิเตอร์ และประจุรวม Q ที่ไหลผ่านวงจรจะคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 Q &= \int_0^{\Delta t} I dt \\
 &= \int_0^{\Delta t} \frac{E dt}{R} \\
 &= \frac{1}{R} \int_0^{\Delta t} \frac{d(N\Phi)}{dt} dt
 \end{aligned}$$

$$Q = \frac{\Delta N\phi}{R} \quad (3.37)$$

เมื่อ ϕ เป็นฟลักซ์แม่เหล็ก

จากกฎของเกาส์ (Gauss 's law) สำหรับฟลักซ์แม่เหล็กจะได้

$$\Delta N\phi = NAB \quad (3.36)$$

จาก (3.37) และ (3.38) จะได้

$$Q = \frac{NAB}{R} \quad (3.39)$$

ในการที่ประจุ Q ผ่านกัลวานอมิเตอร์ ทำให้กัลวานอมิเตอร์เบี่ยงเบนไป θ ดังนั้นจะได้

$$Q = k\theta \quad (3.40)$$

เมื่อ k เป็นค่าคงที่ของกัลวานอมิเตอร์

จากสมการ (3.39) และ (3.40) จะได้

$$B = \frac{kR\theta}{NA} \quad (3.41)$$

การหาค่า k ทำได้โดยให้ขดลวดตั้งอยู่กับที่ ผ่านกระแส I_p ในวงจรถดลวดปฐมภูมิ ของตัวเหนี่ยวนำรวม ดังนั้นจะมีฟลักซ์ลิงเกจ (flux linkage) ในขดลวดทุติยภูมิ ถ้าตัดกระแส I_p อย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ในขดลวดทุติยภูมิ และเกิดมีประจุ Q' ไหลผ่านบัลลิสติก กัลวานอมิเตอร์ และทำให้เบี่ยงเบนไป θ' ดังนั้นจะได้

$$Q' = \frac{\Delta N\phi}{R}$$

$$k\theta' = \frac{M_u I_p}{R} \quad (3.42)$$

ดังนั้นจากสมการที่ (3.41) และ (3.42) โดยการกำจัด k ได้

$$B = \frac{\theta MI}{\theta' NA} P$$

$$\text{หรือ } H = \frac{\theta MI}{\theta' NA} P \quad (3.43)$$

เมื่อ H เป็นความเข้มสนามแม่เหล็ก

M เป็นค่าความเหนี่ยวนำร่วม

N เป็นจำนวนขดลวดของขดลวดค้นหา

A เป็นพื้นที่หน้าตัดขวางของขดลวดค้นหา

θ เป็นการเบี่ยงเบนของบัลลิสติก กัลวานอมิเตอร์ เมื่อดึงขดลวดค้นหาออกจากสนามแม่เหล็ก

θ' เป็นการเบี่ยงเบนของบัลลิสติกกัลวานอมิเตอร์ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิ

I_p เป็นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านในขดลวดปฐมภูมิ

3.7 การคำนวณค่าความผิดพลาดที่น่าจะเป็น (Probable error)

ในการคำนวณหาค่ามวลของไอออนจากสมการ (1.4) เนื่องจากในการวัดค่า H , R และ V ย่อมมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ผลจึงทำให้การคำนวณหาค่า M เกิดความคลาดเคลื่อน¹³

ถ้า ΔM เป็นความคลาดเคลื่อนจากการคำนวณหาค่ามวลของไอออน ΔM อาจหาได้โดยอาศัยสมการ (1.4) จากสมการ (1.4)

$$M = 4.83 \times 10^{-5} \frac{H^2 R^2}{V} \quad (1.4)$$

จากสมการ (1.4) จะเห็นว่า M เป็นฟังก์ชันของ H , R และ V ดังนั้น

$$\Delta M = \frac{\partial M}{\partial H} \Delta H + \frac{\partial M}{\partial R} \Delta R + \frac{\partial M}{\partial V} \Delta V \quad (3.44)$$

เนื่องจากในการหาค่าความคลาดเคลื่อนนั้นจะมีทั้งที่เป็นเครื่องหมายบวกและลบเพื่อตัดปัญหาด้านเครื่องหมายจะทำการยกกำลังสอง ดังนั้นจากสมการ (3.44) จะได้

$$(\Delta M)^2 = \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)^2 (\Delta H)^2 + \left(\frac{\partial M}{\partial R}\right)^2 (\Delta R)^2 + \left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)^2 (\Delta V)^2 \quad (3.45)$$

ค่า $\frac{\partial M}{\partial H}$, $\frac{\partial M}{\partial R}$ และ $\frac{\partial M}{\partial V}$ หาได้จากสมการ (1.4) คือ

$$\frac{\partial M}{\partial H} = 4.83 \times 10^{-5} \left(\frac{2HR^2}{V}\right) \quad (3.46)$$

$$\frac{\partial M}{\partial R} = 4.83 \times 10^{-5} \left(\frac{2RH^2}{V}\right) \quad (3.47)$$

$$\frac{\partial M}{\partial V} = 4.83 \times 10^{-5} \left(\frac{-R^2 H^2}{V^2}\right) \quad (3.48)$$

สมการ (3.46), (3.47) และ (3.48) แทนในสมการ (3.45) แล้วหารด้วยสมการ (1.4) ยกกำลังสอง จะได้

$$\left(\frac{\Delta M}{M}\right)^2 = 4\left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + 4\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 \quad (3.49)$$

เมื่อ ΔH คือ ความผิดพลาดที่น่าจะเป็นของสนามแม่เหล็ก

ΔR คือ ความผิดพลาดที่น่าจะเป็นของรัศมีความโค้งของแนวการเคลื่อนที่ของไอออน

ΔV คือ ความผิดพลาดที่น่าจะเป็นของความต่างศักย์ที่ใช้เร่งไอออน

สำหรับค่า $\left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2$ คำนวณได้จากสูตร (3.43) โดยทำนองเดียวกับ สมการ (3.49) ซึ่งจะได้เป็น

$$\left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 = \left(\frac{\Delta M_u}{M_u}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I_p}{I_p}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \theta}{\theta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \theta'}{\theta'}\right)^2 + \left(\frac{\Delta NA}{NA}\right)^2$$

เมื่อ ΔM_u คือความผิดพลาดที่น่าจะเป็นของ M_u (3.50)

$\Delta \theta$ คือความผิดพลาดที่น่าจะเป็นของ θ

$\Delta \theta'$ คือความผิดพลาดที่น่าจะเป็นของ θ'

ΔI_p คือความผิดพลาดที่น่าจะเป็นของ I_p

ΔNA คือความผิดพลาดที่น่าจะเป็นของ NA